

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所

碩 士 論 文

低溫複晶矽薄膜電晶體在閘極
交流訊號下之可靠度研究



**Study on the Reliability of Low-Temperature
Polycrystalline Silicon Thin Film Transistors under
AC Gate Bias Stress**

研 究 生：江可玉

Ko-Yu Chiang

指 導 教 授：鄭晃忠 博士

Dr. Huang-Chung Cheng

中 華 民 國 九 十 四 年 七 月